一种干涉数据毛刺的检测校正方法

刘加庆^{1,2}*, 韩顺利^{1,2}, 孟鑫^{1,2}, 李志增¹, 鞠军委¹

1中电科仪器仪表有限公司,山东 青岛 266555;

2中国电子科技集团公司第四十一研究所电子测试技术重点实验室,山东青岛 266555

摘要 针对毛刺的实时检测校正需求,提出一种基于滤波和预定义阈值检测的干涉数据毛刺实时检测校正方法, 并给出了基于现场可编程门阵列的硬件实现。在使用较少硬件资源的情况下,所提方法可实现较高的检测精度, 能有效检测出干涉数据中央条纹区可能存在的毛刺,可满足星上数据等实时处理的应用需求。

关键词 光谱学;干涉数据毛刺;实时检测校正;滤波;预定义阈值

中图分类号 O438.2 文献标识码 A

doi: 10.3788/AOS201939.1030002

Detection and Correction Method for Interferogram Spikes

Liu Jiaqing^{1,2*}, Han Shunli^{1,2}, Meng Xin^{1,2}, Li Zhizeng¹, Ju Junwei¹

¹ China Electronics Technology Instruments Co. Ltd., Qingdao, Shandong 266555, China; ² Key Laboratory of Science and Technology on Electronic Test and Measurement, the 41st Research Institute of China Electronics Technology Corporation, Qingdao, Shandong 266555, China

Abstract In this study, a detection and correction method for interferogram spikes is proposed based on filtering and predefined threshold detection to satisfy the requirement of real-time spike detection and correction. We present the algorithm hardware implementation based on a field-programmable gate array. In case of less hardware resources, the detection and correction algorithm achieves high detection accuracy, especially for the spikes of the central fringe of interferogram. The algorithm proposed in this study can be used for real-time on-board interferometric data processing.

Key words spectroscopy; interferogram spikes; real-time detection/correction; filter; predefined threshold OCIS codes 300.6170; 300.6340; 300.6300; 070.2615

1 引 言

干涉分光技术常被用于光谱参数的测量^[1-2],具 有波段覆盖宽、光谱分辨率高、信噪比高、测量速度 快等优势,在紫外、可见光到红外、太赫兹等光学波 段的光谱相关参数测量中应用广泛。例如,以傅里 叶变换红外光谱仪为代表的干涉仪器,已广泛应用 于目标识别、对地观测与外太空探测、大气与环境监 测、光电系统测试、计量等领域^[3-5]。

傅里叶变换红外光谱仪将入射待测光分为两 束,并通过动镜运动等手段,在两束光之间引入相位 差,从而产生干涉,通过干涉调制方式实现入射待测 光的光谱分光。因此,傅里叶变换红外光谱仪获取 的是干涉数据,而不是待测目标的光谱数据,需要经 过傅里叶变换等一系列复杂处理,才能得到目标的 光谱数据^[6]。

红外傅里叶变换光谱仪获取的实际干涉数据中 可能存在脉冲毛刺,干涉图上表现为单点或连续毛 刺。毛刺在光谱域表现为叠加到复原光谱上的光谱 纹波,也是光谱相位的来源之一。目前,可通过移除 探测器衬底、光学组部件采用楔形设计等优化手段, 剔除大部分连续毛刺,剩余的连续毛刺则可在定标 过程中有效移除。对于干涉图中央条纹区域外的单 点毛刺,可通过阈值法等实现有效识别和剔除;对于 干涉图中央条纹区出现的毛刺,由于中央条纹区本 身的幅值变化较为剧烈,故需要更为复杂的检测算

* E-mail: eiqd@ceyear.com

收稿日期: 2019-05-23; 修回日期: 2019-06-11; 录用日期: 2019-06-21

基金项目:国家重点研发计划(2017YFF0106900)、电子测试技术重点实验室稳定经费支持计划(JCKY2019XXXXC038)、预研 基金(JZX7Y201902XXXX01)

法。现有的毛刺检测算法,如哈尔小波变换法、自回 归模型法、标准偏差法、主成分分析法、多重单调神 经网络法等,都有一定的局限性,难以应用于星载观 测、目标探测等需要实时获取目标光谱的应用场合。 此类场合需要对获取的干涉数据进行实时光谱反 演,而在光谱反演之前,对毛刺进行实时检测与校正 对于改善反演光谱质量十分重要^[7-9]。本文采用的 基于滤波和阈值检测的干涉数据毛刺检测方法,可 实现毛刺的有效检测,且便于硬件实现,不占用过多 的硬件资源^[8-9]。

2 基本原理

2.1 傅里叶光谱仪原理

基于经典迈克尔孙干涉仪结构的傅里叶光谱仪 的原理如图 1 所示,包括两块互成直角的动镜 M1 和定镜 M2,以及与 M1、M2 成 45°的分束器 B、补偿 器 C。动境 M1 沿箭头方向作匀速运动,而 M2 为 固定平面镜。理想情况下,入射平行光被分束片 B 分成相等的两束光 I 和 II。补偿器 C 使两束光到 达探测器时,以相同的次数通过分束器 B 和补偿器 C。光束 I 穿过分束器 B 和补偿器 C,经动境 M1 反 射到达探测器 D;另一光束 II 经定镜 M2 反射,穿过 分束器 B 和补偿器 C,在探测器 D 处与光束 I 会合 产生相干叠加,其光程差δ随动镜 M1 的往返运动 呈周期性变化,等于动境运动距离的两倍。干涉信 号的强度分布与光程差、光谱成分等有关。实际上, 傅里叶光谱仪的光谱范围会受探测器、分束器和光 学元件(例如光学滤波器、采样窗口)等的限制^[10-11]。







波数为
$$\nu$$
的单色入射光的电磁辐射可表示为
 $E(x,\nu) = E_0(\nu) \exp[i(\omega t - 2\pi x \nu)],$ (1)

式中, ω 为角频率,t为时间,x为距离, $E_0(\nu)$ 为波数 ν 处入射光电磁辐射的幅值。

该入射光分别经动境和定镜反射后到达探测器,入射光的电磁辐射可表示为

$$E(x_1, x_2, \nu) = rR_1 E_0(\nu) \{ \exp[i(\omega t - 2\pi x_1 \nu)] + \exp[i(\omega t - 2\pi x_2 \nu)] \}, \qquad (2)$$

式中,*x*₁,*x*₂为经动境和定镜光束的光程,*r*和*R*,分别为分束器的反射率和透过率。

探测器接收的入射辐射强度 *I* 是光程差 δ 的函数,可表示为

$$I(\delta) = \frac{1}{2} \epsilon_0 c |E(\delta)|^2 =$$

$$\frac{1}{2} \epsilon_0 c |rR_1 E_0(\nu)|^2 \cdot 2\{(1 + \cos\{[2\pi(x_2 - x_1)]\nu\}\} =$$

$$\frac{1}{2} I(0) [1 + \cos(2\pi\nu\delta)]_{\circ}$$
(3)

式中, ε 。为介电常数,c为光速, $E(\delta)$ 为光程差 δ 时的电磁辐射,I(0)为零光程差处的干涉光强度。由(3)式可知,探测器的输出信号中包含直流项和交流项。

连续光谱入射时,探测器输出干涉信号的积分 形式为

$$I(\delta) = \frac{1}{2} \int_0^\infty B(\nu) d\nu + \frac{1}{2} \int_0^\infty B(\nu) \cos(2\pi\nu\delta) d\nu,$$
(4)

式中,B(v)dv为与入射辐射的波数相关的能量谱密度。对于非理想干涉仪,这一函数受非理想光学系统、探测器响应和电子学系统等的影响。

由于探测器输出的直流项不包含有效光谱信息,去掉(4)式中的直流分量,有

$$I(\delta) = \frac{1}{2} \int_{0}^{\infty} B(\nu) \cos(2\pi\nu\delta) d\nu_{\circ}$$
 (5)

由于 $B(\nu) = B(-\nu)$,探测器输出的交流信号 $I(\delta)$ 关于零光程差点对称,故(5)式可表示为

$$I(\delta) = \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} B(\nu) \cos(2\pi\nu\delta) d\nu =$$
$$\frac{1}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} B(\nu) \exp(i2\pi\nu\delta) d\nu \,. \tag{6}$$

由此可得采样干涉数据与入射辐射满足

$$\begin{cases} I(\delta) = \mathcal{F}[B(\nu)] \\ B(\nu) = \mathcal{F}^{-1}[I(\delta)] \end{cases}$$
(7)

的傅里叶变换关系,目标光谱可由傅里叶逆变换 算出。

实际上进行光谱测量时以 Δδ 为周期对干涉条 纹进行采样,从而得到以 1/Δδ 为周期的光谱 $B_{\Delta\delta}(\nu),$

$$B_{\Delta\delta}(\nu) = B_{\Delta\delta}\left(\nu - \frac{k}{\Delta\delta}\right),\tag{8}$$

式中,k为周期常数。

2.2 毛刺检测/校正算法

干涉数据中存在的单点毛刺如图 2(a)所示, 星载傅里叶红外光谱仪的探测器可能会受到宇宙 高能量射线等的影响,导致探测器输出信号中包 含脉冲干扰信号。美国同步轨道卫星(GOES)的 空间监测数据显示,宇宙射线引发的 X 射线大概为 2000 次/(cm²•s⁻¹)(60 keV X 射线)。红外大气探 测干涉仪(IAIS)在轨监测数据表明,大概1%的干 涉图受到毛刺影响。另外仪器电子学系统的单粒子 数翻转等系统异常、光学组件缺陷、数据下传错误等 也会引起毛刺[12]。该类毛刺的特点是单点或几点, 且幅值非常大,对于反演光谱质量影响最大,是需要 进行检测校正的主要毛刺类型。图 2(b)为连续毛 刺,主要由干涉仪光学元件(如分束器/补偿器)、光 学窗口、探测器等光机系统组件间的反射引起。此 外,仪器的电子学系统,如数据采集系统、运放、数传 接口等的低频噪声也会引入连续毛刺。连续毛刺的 特点表现为在获得的干涉数据的某些位置上会叠加 一段幅值很小的额外干涉图,出现位置有很强的规





律性。将干涉仪零光程差位置的杂散光降至最低, 是仪器光机设计需重点考虑的内容。因此,连续毛 刺一般不会出现在干涉图的中央条纹区,而是多出 现在干涉图的其他区域,在光谱域表现为光谱上出 现纹波。毛刺的存在会严重降低获取的光谱数据的 信噪比,导致光谱失真,影响后续物理参数的反演和 应用。

干涉数据的有效采样点数为 N, 光程 x 处幅值 为A的毛刺会在复原光谱中引起相位为常数、幅值 为 A/N 的三角函数形式的光谱纹波,导致光谱信 噪比降低。在星载观测、目标探测等需要进行实时 光谱反演,以得到实时目标光谱的应用场合,通过对 高幅值脉冲毛刺进行检测和校正,即可消除获取的 光谱中的大部分虚假干扰光谱信号来源,有效改善 反演光谱的质量。连续毛刺等其他类型的毛刺,可 通过优化光机系统设计、后续的定标过程等进行剔 除,可忽略其对反演光谱的影响。例如,干涉数据中 存在的毛刺会引起目标光谱的相位和幅值等异常。 本文主要针对高幅值脉冲毛刺进行检测校正,而对 于本文毛刺检测未考虑的连续毛刺、低频噪声等异 常信号,以及本文简单采用均值校正毛刺可能引入 的误差等,通过后续光谱反演环节的相位修正都能 进行有效抑制和消除,从而实现全部毛刺干扰的抑 制,有效改善获取光谱的质量。

需要进行检测和校正的高幅值毛刺如图 2(a) 所示,毛刺幅值和出现位置的差异很大,为实现高精 度的毛刺检测,可以设计很多复杂算法,但考虑到星 上处理等实时处理场合,检测算法在保证检测精度 的同时应尽量简便,以避免占用过多的资源。干涉 数据中央条纹区幅值变化剧烈,如果直接使用阈值 法,则这一区域的毛刺很难检出,本文采用先滤波、 后阈值检测的方法,可较好地解决这一问题。

毛刺校正的方法为采用毛刺左右临近点均值代 替毛刺点。毛刺检测算法的基本原理如下:在光谱 域,有用光谱信息为仅分布在有限宽度的低波数光 谱带内的光谱信号,干涉图上的毛刺则分布在整个 光谱带上;而有效带内光谱信号,是获取以零光程差 点为对称点且幅值以余弦包络形式变化的干涉数据 的主要来源,这使得毛刺难以检测。因此,通过对干 涉图进行低通滤波,滤除有效带内光谱,可降低干涉 图的幅度变化,从而凸显出毛刺,特别是原先被中央 条纹区大幅度的幅值变化所遮盖的毛刺,从而降低 检测的难度。由于毛刺在干涉图上表现为幅值异常 的采样点,通过设置合理的阈值,采用幅值比较的方 法,即可将毛刺检测出来。

基于滤波方法进行毛刺检测的两个前提条件 如下:

1) 与奈奎斯特采样定理相比,干涉数据已经被 过采样;

 2) 获取的干涉数据中出现毛刺是小概率事件, 且呈单点分布(需注意的是,数据采样过程使用的抗 混叠滤波器可能会将单点毛刺扩散到邻近几个点)。

基于滤波和阈值检测方法的毛刺检测算法模型 如下:

1)采样干涉数据 *I*(*p*)中央条纹区的毛刺检测,是中央条纹区采样点与 *N*_{CF} 阶滤波器滑动卷积的结果 *I*_{CF}(*m*),

$$I_{\rm CF}(m) = \sum_{p=m-(N_{\rm CF}-1)/2}^{m+(N_{\rm CF}-1)/2} I(p) \times W_{\rm CF}(p-m), (9)$$

式中,W_{CF}为滤波器的滤波系数,p和m为干涉图采 样点的索引号。

与检测阈值 T_{CF} 逐点比较,如果 $I_{CF}(m) > T_{CF}$,则给出毛刺标志。

采样干涉数据中央条纹区的均值 I_{ACF} 为

$$\overline{I}_{ACF} = \frac{\sum_{i=N_{\text{firstSpikCF}}}^{N_{\text{lastSpikCF}}} I(i)}{N_{\text{lastSpikCF}} - N_{\text{firstSpikCF}}} \,. \tag{10}$$

采样干涉数据中央条纹区的标准差 Scr为

$$\sqrt{\frac{1}{N_{\text{lastSpikCF}} - N_{\text{firstSpikCF}}} \sum_{i=N_{\text{firstSpikCF}}}^{N_{\text{lastSpikCF}}} [I(i) - \overline{I}_{\text{ACF}}]^2} .$$
(11)

检测阈值 T_{CF}可参照标准差倍数选取,为

 $T_{\rm CF} = a_{\rm CF} \times S_{\rm CF} + O_{\rm CF}, \qquad (12)$

式中,*I*(*i*)为待检测采样干涉数据,*N*_{firstSpikCF}为采样 干涉数据中央条纹区起始点,*N*_{lastSpikCF}为中央条纹 区结束点,*a*_{CF}为标准差系数,*O*_{CF}为干涉图偏置量。 滤波器的阶次 *N*_{CF}及对应的滤波系数 *W*_{CF}、检测阈 值 *T*_{CF}需要根据具体干涉仪器、应用场合、用途等进 行调整选择。对于星上处理等场合,则需要根据毛 刺检测/校正效果,对检测阈值和滤波器所用阶次进 行及时更新。

2) 干涉数据其他区域的毛刺检测。将其他区域的采样干涉数据与 N_{CFO}阶滤波器作滑动卷积,并 将卷积结果 I_{CFO}(m)与阈值 T_{CFO}逐点比较。

$$I_{\rm CFO}(m) = \sum_{p=m^{-(N_{\rm CFO}-1)/2}}^{m^{-(N_{\rm CFO}-1)/2}} I(p) \times W_{\rm CFO}(p-m),$$

m + (N - -1)/2

式中,WCFO为滤波器的滤波系数。

如果 $I_{CFO}(m) > T_{CFO}$,则给出毛刺标志。

检测阈值 T_{CFO}计算过程为取邻近中央条纹区的一个包络计算检测阈值,包络采样起始点为 n₁,结束点为 n₂。

包络的均值Īcro为

$$\bar{I}_{\rm CFO} = \frac{\sum_{i=n_1}^{n_2} I(i)}{n_2 - n_1 + 1},$$
(14)

包络的标准偏差 ScFo 为

$$S_{\rm CFO} = \sqrt{\frac{1}{n_2 - n_1} \sum_{i=n_1}^{n_2} \left[I(i) - \bar{I}_{\rm CFO} \right]^2} \,.$$
(15)

检测阈值 T_{CFO}可参照标准差倍数选取,可表示为

$$T_{\rm CFO} = a_{\rm CFO} \times S_{\rm CFO} + O_{\rm CFO}, \qquad (16)$$

式中,acro为标准差系数,Ocro为干涉图偏置量。

相比干涉数据中央条纹区采样点幅值的剧烈变 化,干涉数据其他区域采样点的幅值变化较为平缓, 因此所用滤波器阶数 N_{CFO}要低于中央条纹区所用 滤波阶数。滤波器所用阶次 N_{CFO}及对应的滤波系 数 W_{CFO}、检测阈值 T_{CFO},同样也需要根据具体干涉 仪器、应用场合、探测任务与精度要求等进行选择 调整。

3)毛刺校正。对于检测出的高幅值毛刺,用左 右临近点的均值代替,即可消除毛刺对反演光谱的 主要影响,并将校正误差控制在实际获取光谱数据 自身的噪声水平以下,取得不错的校正效果。

3 分析与讨论

3.1 毛刺检测算法实验与分析

毛刺检测校正算法流程图如图 3 所示。取一幅 由星载干涉仪器获取的存在高幅值毛刺的长波通道 (700~1130 cm⁻¹)干涉数据,并参考获取的系列干 涉数据中存在高幅值毛刺的特点,在选取的干涉数 据上,人为添加数个毛刺,以使得中央条纹区和其他 区域均存在不同幅值的毛刺,如图 4 所示。参考激 光波数为 6451.6 cm⁻¹,采用双过零点法的等效参 考采样 波数 为 12903.2 cm⁻¹。中央条纹区采用 13 阶有限脉冲反应(FIR)滤波器,其他区域则采用 5 阶 FIR 滤波器。高通 FIR 滤波器的归一化截止 频率为 0.3,阻带衰减为-50 dB,通带起伏为-1 dB, 使用 MATLAB 计算相应的滤波器系数。

存在毛刺干涉数据的滤波结果如图5所示,存

(13)



图 3 毛刺检测校正算法流程图







Fig. 5 Interferogram with spikes after filtering

在毛刺的干涉数据在未滤波和滤波后,反演得到的 目标光谱如图 6 所示,可见,通过滤波可消除绝大部



分有效光谱信息,从而避免目标光谱信息对毛刺检 测的影响。干涉数据中央条纹区的滤波结果如 图 5(a)所示,由于残余光谱信息的存在,滤波数据 仍具有类似干涉图的特征,但是可能存在的毛刺则 被凸显出来。对于可能在中央条纹区的波峰位置出 现的毛刺,经滤波处理去掉有效光谱信息后,使得毛 刺特征更为突出,有效降低了波峰位置对毛刺检测 的干扰,从而提高了后续毛刺检测的精度;对于位于 波谷、波峰和峰谷间的毛刺,经滤波处理后,可将原 先被中央条纹区剧烈的幅值波动淹没掉的毛刺凸显 出来,而这些位置的毛刺会影响干涉数据毛刺检测, 同时也会影响反演光谱质量。干涉数据其他区域的 滤波结果如图 5(b)所示,由傅里叶光谱仪的原理可 知,干涉数据其他区域以一定间隔(与仪器工作波 段、光机系统参数等有关)分布着系列类似中央条纹 区的包络,且包络幅度随光程差的增加而降低。因 此,对于系列包络中可能存在的毛刺,通过滤波同样

可以将位于包络区域的毛刺显现出来,设置合适的 阈值,通过逐点比较滤波结果,即可将可能存在的毛 刺检测出来。

选取一幅不存在毛刺的长波通道(700~ 1130 cm⁻¹)干涉数据,在采样干涉数据的不同位 置,直接利用左右临近点均值替代原始采样点,并计 算校正后的反演光谱相对原始干涉数据反演光谱的 误差,以对毛刺校正误差进行分析,结果如图7所 示。可见,仅当毛刺出现在中央条纹区时会有10⁻⁵ 量级的校正误差,其他位置的校正误差基本可以忽 略,总体校正误差在反演光谱的噪声限以内。可见, 对于高幅值单点毛刺,所用校正方法具有较高的校 正精度,可满足星上实时数据处理等场合的应用 需求。







图 8 为存在毛刺的干涉数据在未校正和校正后 的反演光谱,可见毛刺的存在,会在带内光谱上引入 光谱纹波,造成光谱信噪比降低,影响获取光谱的质 量,这与前面的理论分析相吻合。因此,对于星载观 测、目标探测等需要实时获取目标光谱的应用场合,





在进行反演光谱处理前,应先对可能存在的毛刺进 行检测和校正,以有效抑制毛刺引起的光谱纹波对 带内光谱的影响。

3.2 基于现场可编程门阵列的硬件实现

毛刺检测校正算法的硬件实现采用 Xilinx V5 110T FPGA,如图 9 所示,其中,检测模块 1 用于中 央条纹区的毛刺检测,检测模块 2 负责其他区域的 毛刺检测。校正模块负责毛刺的修正,即读取毛刺 左右临近两点的采样值,计算其均值,并用均值代替 毛刺点。待检测的干涉数据存储在双口随机存取存 储器(RAM)中,由于一个时钟只能对双口 RAM 读 写一次,完成一幅 8192 点干涉数据图的检测需 8194 个时钟周期,每发现并校正一个毛刺需额外增 加 5 个时钟周期,每发现并校正一个毛刺需额外增 加 5 个时钟周期。毛刺检测校正算法采用现场可编 程门阵列(FPGA)实现时,所需硬件资源如表 1 所 示。在实际应用中,可用多路并行模式降低所需时 钟周期,提高采样干涉数据的毛刺检测/校正速度, 以满足不同应用场合和不同数据采样率仪器的应用 需求,不足之处是会增加控制难度和所需FPGA逻





Fig. 9 Hardware implement of detection/correction algorithm for spikes. (a) Modular scheme; (b) simulation result

表 1	FPGA 算	算法实现时	所需硬件	丰资源
Table 1	Required	hardware	resource	for FPGA

algorithm	implementation	

	1		
Logic resource	Occupied slices	Total number of slices	Logic utilization / %
Slice registers	15	69120	0.021
Slice LUTs	18	69120	0.026
Fully used LUT-FF pairs	1	18	5.555
Bonded IOBs	4	640	6.250
BUFG/BUFGCTRLs	1	32	3.125

辑资源。即将单幅干涉图由存储在单个大双口 RAM中改为存储在 N 个小双口 RAM 中,对应使 用相同数目的检测模块并行检测,可将处理时间降 为原来的 1/N。

4 结 论

针对红外傅里叶光谱仪在星载探测、目标探测 等需要进行实时光谱反演的应用场合,提出一种基 于滤波和阈值检测的高幅值单点毛刺的实时检测/ 校正方法,并给出了基于 FPGA 的硬件实现。在使 用较少硬件资源的情况下,所提方法可实现较高的 检测精度,特别是可对干涉数据中央条纹区域可能 存在的毛刺实现有效检测,满足星上实时数据处理 等的应用需求。本方法的检测阈值仍需要通过大量 的实际观测数据,通过实验的方式确定,并需根据实 际应用时的效果,调整预定义检测阈值。下一步将 重点研究自适应阈值的确定方法。

参考文献

- [1] Persky M J. A review of spaceborne infrared Fourier transform spectrometers for remote sensing[J]. Review of Scientific Instruments, 1995, 66(10): 4763-4797.
- [2] Lü J G, Liang J Q, Liang Z Z, et al. Wavefront aberration analysis and spectrum correction of microminiature Fourier transform spectrometer [J]. Acta Optica Sinica, 2018, 38(2): 0230001.
 吕金光,梁静秋,梁中翥,等. 微小型傅里叶变换光 谱仪波前像差分析与光谱修正[J].光学学报, 2018, 38(2): 0230001.
- [3] Kozlov D A. Radiometric calibration of the IKFS-2 on-board IR Fourier spectrometer for temperature and

humidity probing of the Earth's atmosphere[J]. Journal of Optical Technology, 2013, 80(2): 110-114.

- [4] Formisano V, Angrilli F, Arnold G, et al. The planetary Fourier spectrometer (PFS) onboard the European Mars Express mission [J]. Planetary and Space Science, 2006, 54(13/14): 1298-1314.
- [5] Kuze A, Suto H, Nakajima M, et al. Thermal and near infrared sensor for carbon observation Fouriertransform spectrometer on the Greenhouse Gases Observing Satellite for greenhouse gases monitoring [J]. Applied Optics, 2009, 48(35): 6716-6733.
- [6] Revercomb H E, Buijs H, Howell H B, et al. Radiometric calibration of IR Fourier transform spectrometers: solution to a problem with the highresolution interferometer sounder [J]. Applied Optics, 1988, 27(15): 3210-3218.
- [7] Snively C M, Koenig J L. Characterizing the performance of a fast FT-IR imaging spectrometer[J]. Applied Spectroscopy, 1999, 53(2): 170-177.
- [8] Ibrahim A. Spectroscopic study of channel spectra phenomena in the synchrotron-based FTIR spectrometer at the Canadian light source [D]. Alberta, Canada: University of Lethbridge, 2010: 15-30.
- [9] Goddard Space Flight Center. Joint polar satellite system(JPSS) cross track infrared sounder (CrIS) sensor data records (SDR) algorithm theoretical basis document (ATBD) [Z/OL]. (2009-02-20) [2019-05-08]. http: // asl. umbc. edu/pub/reports/external/ 474-00032_CrIS-SDR-ATBD_Rev-.pdf.
- [10] Yang M Z, Zou Y P, Zhang L, *et al*. Correction to nonlinearity in interferometric data and its effect on radiometric calibration [J]. Chinese Journal of Lasers, 2017, 44(1): 0110002.
 杨敏珠,邹曜璞,张磊,等.干涉数据中非线性的校正及其对辐射定标的影响[J].中国激光,2017,44(1): 0110002.
- [11] Li P, Yang SS, Ding ZH, et al. Research progress in Fourier domain optical coherence tomography[J]. Chinese Journal of Lasers, 2018, 45(2): 0207011.
 李培,杨姗姗,丁志华,等.傅里叶域光学相干层析 成像技术的研究进展[J].中国激光, 2018, 45(2): 0207011.
- [12] Carter S, McLaughlin C, Sabol C, et al. Spaceflight dynamics support for the MightySat II. 1 hyperspectral payload operations [J]. Astrodynamics, 2000: 693-709.